

Judul:

Determination of thin films thickness by tolansky interferometry

Pengarang/Penulis:

Farid Wadjdi Machmud, author

Subjek:

Interferometry

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)